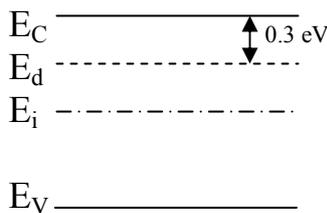


بسمه تعالی

آزمون میان‌ترم فیزیک الکترونیک - ۲۵ / ۸ / ۱۳۸۵ - وقت: ۱:۴۵ - منصوری

<p>سوال ۱</p> <p>(۲)</p> <p>ثابت شبکه‌ای سیلیکون $a = 5.43 \text{ \AA}$ است. الف) چه تعداد اتم Si در هر سانتی‌متر مکعب وجود دارد. ب) اگر چگالی الکترون‌ها در باند هدایت Si در حدود 10^{10} cm^{-3} می‌باشد. چگالی الکترون‌ها در باند ظرفیت Si را محاسبه کنید.</p>	<p>سوال ۱</p> <p>(۲)</p>
<p>سوال ۲</p> <p>(۲)</p> <p>مفهوم جرم موثر را بیان کنید. چرا نمی‌توان جرم الکترون را در یک نیمه‌هادی، ثابت فرض نمود.</p>	<p>سوال ۲</p> <p>(۲)</p>
<p>سوال ۳</p> <p>(۴)</p> <p>نمونه‌ای از نیمه‌هادی Si نوع P دارای $P = N_a = 10^{13} \text{ cm}^{-3}$ می‌باشد. چه مقدار از یک ناخالصی با یک تراز دهنده (E_d) که در شکل مقابل نشان داده شده است، به نمونه‌ی فوق اضافه کنیم تا اینکه نیمه‌هادی حاصل دارای $n = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ گردد. E_i را دقیقاً در وسط باند ممنوع فرض کنید و $E_g = 1.1 \text{ eV}$, $T = 300 \text{ K}$, $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$</p> 	<p>سوال ۳</p> <p>(۴)</p>
<p>سوال ۴</p> <p>(۴)</p> <p>برای اندازه‌گیری α_r (ثابت بازترکیب)، آزمایش زیر را انجام می‌دهیم: بر روی نمونه‌ای از نیمه‌هادی Si نوع $n \langle p \rangle$ ($n \gg p$)، به طول $l = 1 \text{ cm}$ و سطح مقطع $A = 0.25 \text{ cm}^2$ دو اندازه‌گیری انجام داده‌ایم: I - ابتدا ولتاژ $1V$ را بر نمونه وارد کرده و جریان نمونه را اندازه‌گیری کردیم: $I = 100 \text{ mA}$ II - با تاباندن نور، $10^{22} \frac{\text{EHP}}{\text{cm}^3 - \text{Sec}}$ در نیمه‌هادی تولید می‌کنیم و مجدداً ولتاژ فوق را وارد کرده و جریان را اندازه می‌گیریم: $I = 200 \text{ mA}$ ضمن محاسبه α_r، مقدار ناخالصی N_d در نمونه و مقدار τ_p (طول عمر حفره‌ها) قبل و بعد از تاباندن نور را تعیین نمایید. برای Si داریم: $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_p = 400 \frac{\text{cm}^2}{V - \text{Sec}}$, $\mu_n = 1200 \frac{\text{cm}^2}{V - \text{Sec}}$</p>	<p>سوال ۴</p> <p>(۴)</p>
<p>سوال ۵</p> <p>(۳)</p> <p>به یک نیمه‌هادی Si به طول $l = 2 \text{ cm}$ که دارای $n = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ می‌باشد، ولتاژ $1V$ اعمال می‌کنیم. دیاگرام باند انرژی این نیمه‌هادی را در این حالت رسم کنید.</p>	<p>سوال ۵</p> <p>(۳)</p>

صفحه دوم آزمون میان ترم فیزیک الکترونیک - ۱۳۸۵ / ۸ / ۲۵ -

سوال ۶ (۶)	<p>یک قطعه نیمه‌هادی نوع P غیرواگن (un degenerate) را در درجه حرارت اطاق در نظر بگیرید. در لحظه $t = 0$ یک پالس، حامل اضافی در داخل نیمه‌هادی ایجاد می‌کند. می‌خواهیم نشان دهیم که اختلال در غلظت حامل‌های اکثریت (حفره‌ها)، $\delta P(t)$، بطور نمایی با زمان کاهش خواهد یافت؛ و این کاهش به وسیله یک ثابت زمانی τ که به زمان ثابت دی‌الکترونیک مربوط می‌شود، مشخص می‌شود. این زمان برای دوباره آراستن حامل‌های اکثریت در پاسخ به یک اختلال فرض می‌شود.</p> <p>الف) معادله پیوستگی را برای حفره در داخل نمونه بنویسید. (چرا معادله دیفیوژن را برای حفره‌ها نمی‌نویسید؟)</p> <p>ب) با فرض اینکه تولید و بازترکیب و پروسه‌های دیگر در داخل نمونه اثر ناچیزی روی $\delta P(t)$ دارند، فرم ساده شده معادله پیوستگی حفره‌ها را بطور مناسبی بنویسید.</p> <p>ج) فرض کنید داخل نمونه، جریان پخششی (diffusion) نسبت به جریان رانشی (drift) کوچک باشد. در داخل نمونه J_p را بنویسید. با فرض $p = N_a + \Delta p \approx N_a$، معادله فوق را ساده کنید.</p> <p>د) معادله پواسون را برای این نمونه بنویسید و بطور واضح دانسیته بار (ρ) را بیان کنید. (توجه کنید که در این نمونه $N_a \gg n$ و $p \gg n$ می‌باشد.)</p> <p>ه) نتایج قسمت (ب)، (ج) و (د) را برای دست‌یافتن به معادله دیفرانسیلی برای p ترکیب کنید. فرض کنید که $p = N_a + \delta p$. معادله دیفرانسیل را برای $\delta P(t)$ حل کنید و با حل این معادله نتیجه بگیرید که نیمه‌هادی تحت چه پارامترهایی به تعادل می‌رسد.</p> <p>و) ثابت زمانی τ را برای $N_a = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$، $\mu_p = 458 \frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{Sec}}$، $\epsilon_r = 11.8$ محاسبه نمایید.</p>
---------------	---

موفق باشید - منصوری